

## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 $\theta$ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ:  $|\Delta(\text{LogI})|$ 

最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数

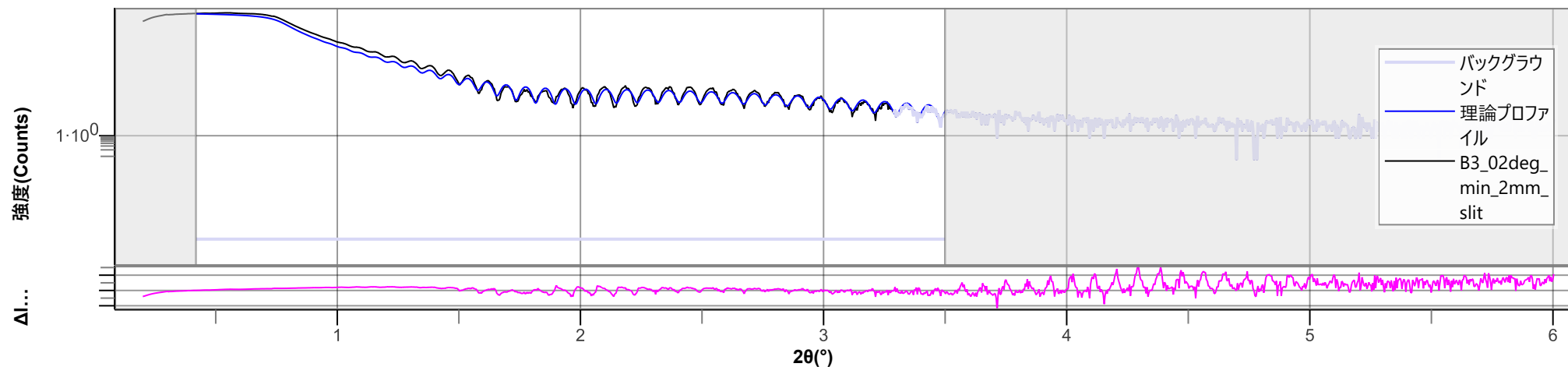
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm) <th>	密度(g/cm <sup>3</sup> ) <d>	粗さ(nm) <rg>	
<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.766 Const ±0.02 精密化	2.57033 Const ±0.05 最小ー 精密化	0.236 Con...	
<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.315 Const ±0.03 精密化	4.95000 Const ±0.04 ー最大 精密化	0.262 Con...	
<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	93.546 Const ±0.05 ー最大 精密化	7.87400 Const ±0.05 ー最大 精密化	0.669 Con...	
<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	1.131 Const	4.39941 Const	0.100 Con...	
<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	